# サニャック型回転シア干渉計の試作

先進理工学科 宮本研究室 1113122 中澤 誠人

#### 1 目的

本研究では、ダブプリズムと偏光を用いたサニャック型回転シア干渉計を試作し、動作を確認することを目的とする。ダブプリズムを用いたサニャック型干渉計を大まかに構成し、ダブプリズムの回転に対する各光路を通る光の回転方向の違いを確認する。

#### 2 ダブプリズム

ダブプリズムは像回転プリズムとも言われ、プリズムを回転させると透過像は2倍の速さで回転する。また、入射光はプリズムの底面で全反射する。ダブプリズムの入射位置と出射位置の関係を図1に示す。

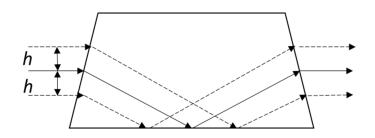


図 1: ダブプリズムの入射位置と出射位置の関係

図1中の実線はダブプリズムの中心に入射する光、破線はそれぞれダブプリズムの中心に入射する光に対して鉛直方向に+h、-hだけずれて入射した光である。ダブプリズムの中心に入射した光は入射した高さと同じ高さで出射する。また、ダブプリズムの中心に入射する光に対して鉛直方向に+h、-hだけずれて入射した光はそれぞれ-h、+hだけずれて出射する。

## 3 サニャック型回転シア干渉計

回転シアとは、光波とその複製を重ね合わるときに光波とその複製を相互に回転させることを表す。本研究では、回転シアを導入するためにダブプリズムを用いたサニャック型干渉計を構成する。具体的にパターン1(図2)、パターン2(図3)の2通りの干渉計を検討した。実線はダブプ

リズムの回転軸上に入射する光線、破線は実線に対して水平方向にずれた位置に入射して入口の ビームスプリッターで反射した光の経路を示している。

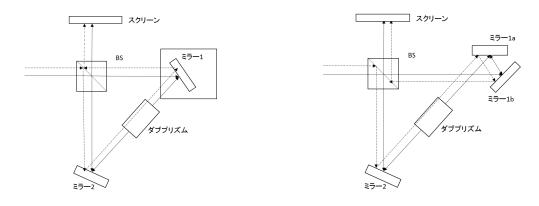


図 2: サニャック型干渉計 (パターン1) 図 3: サニャック型干渉計 (パターン2)

#### 4 ダブプリズムの回転に対する各光路を通る光の回転方向の測定

図2、3の干渉計を右回りに「通過する光路を光路1、左回りに通過する光を光路2とする。図 3の場合は、光路1を通る光はビームスプリッターを透過し、ミラー1b、ミラー1a、ダブプリ ズム、ミラー2の経路を通る。光路2を通る光はビームスプリッターで反射し、ミラー2、ダブ プリズム、ミラー 1a、ミラー 1b の経路を通る。ダブプリズムの回転に対するこの 2 つの光路を 通る光の回転方向を確認する。パターン2の場合の光学系を図4に示す。

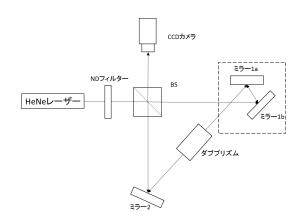


図 4: 各光路の回転方向の測定に用いる光学系 (パターン 2)

#### BS ビームスプリッター

HeNe レーザーをビームスプリッターに入射し、光路1、光路2を通る光に分ける。光路1を通 る光はビームスプリッターを透過し、ミラー1b、ミラー1a、ダブプリズム、ミラー2の経路を 通る。光路2を通る光はビームスプリッターで反射し、ミラー2、ダブプリズム、ミラー1a、ミ ラー 1b の経路を通る。光路 1、光路 2 を通る光をビームスプリッターで合成する。ダブプリズ ムの目盛りを $20^{\circ}$ 、 $60^{\circ}$ 、 $100^{\circ}$ 、 $140^{\circ}$ に設定し、 CCD カメラ上の強度分布を記録し、ダブプ リズムの回転に対する各光路を通る光の回転方向を確認した。

図 4 の光学系におけるダブプリズムの目盛りを  $20^\circ$ 、  $60^\circ$ 、  $100^\circ$ 、  $140^\circ$ に設定したときの 光路 1 を通る光の CCD カメラ上における強度分布を図 5 に示す。

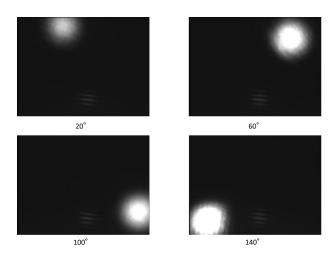


図 5: ダブプリズムの回転に対する光路1を通る光の回転方向(パターン2)

図 5 より光路 1 を通る光は時計回りに回転することが確認できる。同様にして光路 2 を通る光の CCD カメラ上における強度分布を図 6 に示す。

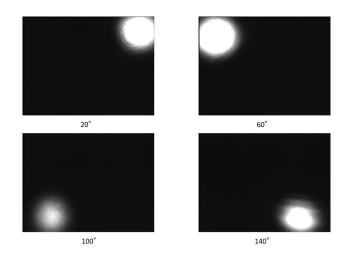


図 6: ダブプリズムの回転に対する光路 2 を通る光の回転方向 (パターン 2)

図 6 より光路 2 を通る光は反時計回りに回転することが確認できる。この配置を用いることで回転シアを導入することができる。一方、パターン 1 の場合は光路 1, 2 とも時計回りの回転であり、回転シアは導入できない。

# 5 結論

ダブプリズムを用いたサニャック型干渉計を大まかに構成し、ダブプリズムの回転に対する各 光路を通る光の回転方向の違いを測定した。パターン2の配置を用いればダブプリズムの回転に 対して光路1を通る光は時計回り、光路2を通る光は反時計回りに回転することが確認できた。

## 6 今後の展望

パターン 2 の配置を用いてサニャック型干渉計を組み、偏光ビームスプリッターを使用して光路 1 を通る光を p 偏光成分、光路 2 を通る光を s 偏光成分として二つの光を完全に重ね合わせる。そして、偏光を用いた位相シフト干渉計とし、方位角方向の位相勾配を測定する。

## 参考文献

- [1] 米村 高志, 「偏光を利用する位相測定法の改良とラゲールガウスビームの位相分布測定」 電気通信大学 修士論文 (2006)
- [2] 吉村 武晃, 「光情報工学の基礎」 コロナ社 (2010)
- [3] 霜田 光一, 「レーザー物理入門」岩波書店 (2000)
- [4] シグマ光機株式会社 総合カタログ 9 (2008)